

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 52085841 A

(43) Date of publication of application: 16 . 07 . 77

(51) Int. CI

G01B 7/28 G01B 7/00

(21) Application number: 51001460

(22) Date of filing: 09 . 01 . 76

(71) Applicant:

NEC CORP

(72) Inventor:

ASAI HIROSHI

(54) PATTERN POSITION DETERMINING **APPARATUS**

(57) Abstract:

PURPOSE: To determine the position by coincided

coordinate system by comparing the relations between characteristic points in comparative checking, etc. of fringe patterns such as fingerprints, etc.

COPYRIGHT: (C)1977,JPO&Japio

(9日本国特許庁

切特許出願公開

公開特許公報

昭52—85841

DInt. Cl2. G 01 B 7/28 G 01 B 7/00

識別記号

62日本分類 广内整理番号 106 F D

106 C 3

106 E 0

7119-24

7122-24 7517 - 24

43公開 昭和52年(1977)7月16日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

匈図形位置決定装置

②特

顋 昭51-1460

22出

昭51(1976) 1月9日

の発 明 浅井紘 東京都港区芝5丁目33番1号日

本電気株式会社内

の出 願

人 日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目33番1号

邳代 理 人 弁理士 芦田坦

外3名

1.発明の名称

図形位置決定装置

2. 特許請求の範囲

2つの2次元図形に配位している特徴点を比 較するために、2つの2次元図形の座機を一致 させる図形位置決定装置において、前配各2次 元図形上の前記特徴点の配位を保持する第1及 び第2の配位記憶装置と、前配各2次元図形の 前記特徴点間の関係を保持する第1及び第2の 関係記憶装置と、第1及び第2の関係記憶装置 から読出された前記券徴点間関係の一致を検出 し、前記両図形において対応する特徴点を複数 個決定する一致検出回路と、前記一致検出回路 で決定された前配各.2次元図形における前記板 数個の特徴点の重心位置をそれぞれ求める第1 及び第2の重心演算器と、前配第1及び第2の 重心演算器で算出された前記重心位置間の差を 算出する減算器と、前記各重心位置を原点とす る前記特徴点の各図形上における角度を計算す

する第1及び第2の角度演算器と、前配第1及 び第2の角度演算器で計算された角度を受け、 前配両図形の対応する前配特徴点における角度 差を算出し、前記角度差の平均値を求める平均 角度差回路及び前記各記憶装置、前記各演算器 を制御する制御回路とを備えたことを特徴とす る図形位置検出装置。

8.発明の詳細な説明

本発明は指数等の総紋様を比較照合する際に 使用される図形位置決定装置に関するものであ

一般に、指紋をコンピュータにより照合同定 する場合、指紋に配位している分肢点及び端点 等の特徴点を照合する方式が採用されている。 との方式では、指紋における特徴点の位置並び にその位置における降級方向を前以つて記憶さ れているファイル指紋の特徴点位置及び方向と 比較するととによつて照合を行なつている。

前述した照合を行なうためには、ファイル指 放における座標と入力指紋の座標とが一致して

いることが必要である。通常、指似抽出の際の 選標として、軟内側隔線の頂点を中心とする半 径2 mmの円を描き、この円と最内側路線の左側 路級との交叉点を求め、この交叉点と中心とを 結ぶ線を座標の一軸とするものが使用されてい

一方、指紋は弾力のある皮膚上に存在しているから、押捺時における力の入れ具合等、押捺祭件によつてを離は変動してしまう。 このため、経体を存した座標も浮動してしまう。 このため、松徹点照合の際にはまず、入力指紋とファイル指紋との座標系を合設させる必要があるが、一般に、は座標系の変動を座標系と同様に変動する。、

座標系の変動によって影響を受けない特徴点に関する情報として、本発明者は各特徴点近傍における特徴、特に、特徴点と他の特徴点との相対的関係を利用することを提案した。このように、特徴点間関係を抽出しておき、指紋照合

とファイル図形から選択された対応する特徴点対間の角度差の平均値を求めることによつて、 座標系の移動量を算出する図形位置決定装置を 提供することである。

本発明によれば、入力図形とファイル図形からそれぞれ抽出された特徴点間関係を比較し、特徴点間関係が一致した特徴点を複数個決定し、
これら複数個の特徴点における配位から、座標系の移動量を算出し、両座標系を一致させる図形位置決定装置が得られる。

更に、本発明では、特徴点間関係から選択では、特徴点間関係から選択びれた複数個の特徴点の重心位置を入力図形及びファイル図形についてそれぞれ其出し、座標系の平行移動量を検出することによつて、座標系の回転移動量を検出できる図形位置決定装置が得られる。

以下、図面を参照して本発明を説明する。

第1図(A)及び(B)は本発明によつて照合される 指数を示し、ととでは、特数点及びその位置に 特別の第12-85841(2)の際に、この特徴点間の関係をも併せ参照すれば、対象となるファイル指紋の数を前処理段階において著しく少なくでき、以後の指紋同定を容易に行なりことが可能である。

ところで、入力指紋及びってイル指紋との座標系を一致させる場合にも、 前述した座標系に依存しない特徴点間関係を利用できれば、 図形の一致検査が容易且つ正確に なるものと 考えられる。

本発明の目的は特徴点間関係を積極的に利用して、入力図形とファイル図形との座標系を一致させる図形位置決定装置を提供することである。

本発明の他の目的は入力図形とファイル図形との間における特徴点間関係並びに特徴点の配位から座標系を一致させる図形位置決定装置を提供することである。

本発明のより他の目的は入力図形及びってイル図形から選び出された複数個の特徴点における重心位置をそれぞれ求めると共に、入力図形

おける方向のみが示されている。第1図の及び (B)を参照すると、図形 A の特徴点 a_w , a_v , a_k 及び a_h と図形 B の特徴点 b_n , b_n , b_i , 及び b_j は本来一致しているが、破 戀で示される 座標系が一致していないので、図形 B を図形 A にそのまま重ねても一致しない。

そとで、本発明では特徴点間関係Rを見出し、 との関係Rを比較する。特徴点間関係Rとして はある特徴点と他の特徴点間に存在する隆級数 Rw、両特徴点間の距離 Rb 及び両特徴点におけ る相対的な一対の連結方向 Rs , Re とを抽出す るものとする。とれら特徴点間関係 Rから、

$$R(a_k; a_h) = R(b_i, b_j)$$

$$R(a_w, a_v) = R(b_m, b_n)$$

が検点されると、 aw と bm , av と bn , ak と bl , ah と bl の対候補が決定される。これら対 機補から図形 B を図形 A に マップするときの座 篠回転移動量 0 と、平行移動量 dX , dY を次式 のように平均値によつてあらわす。

$$\theta = \text{Ave}\left(\angle \overline{a_k a_w} - \angle \overline{b_j b_m}, \angle \overline{a_k a_v} - \angle \overline{b_j b_n}, \angle \overline{a_k a_v} - \angle \overline{b_j b_n}, \angle \overline{a_h a_v} - \angle \overline{b_j b_n}, \cdots \cdots (1)\right)$$

$$dX = \frac{1}{4}\left(\underbrace{\Sigma}_{w_i v_j k_j h} a^x - \underbrace{\Sigma}_{\dot{m}_i n_j 1, j} b^x\right)$$

$$dY = \frac{1}{4}\left(\underbrace{\Sigma}_{w_i v_j k_j h} a^y - \underbrace{\Sigma}_{\dot{m}_i n_j 1, j} b^y\right)$$
.....(2)

第(1)式を参照すると、線分 awav と線分 bmbn の対は採用されていないことがわかる。これは極めて近傍にある特徴点間関係 R では充分な精度が得られないことを考慮したものである。

前述した式は対機補が更に増加した場合にも本質的に変わらない。但し、対機補を多数発見できる場合は、偶発的に本来対をなさないものを対候補として摘出する危険性を回避するために、のを算出する際に平均値に対して大きくはずれる対像補を削除することが合理的である。

第2図は本発明の一実施例を示すプロック図である。第2図を参照すると、この実施例は入 カ図形んにおける特徴点の配位(位置及び方向) を記憶した特徴点記憶装置10A、入力図形A の特徴点間関係を保持した関係記憶装置11A

それぞれX軸減算器 I 5 X 及び Y 軸減算器 15Y に加えられると共に、角度演算器 1 6 A 及び 1 6 B に供給される。両被算器 1 5 X 及び 15Y ではそれぞれX軸方向及びY軸方向における重 心位置の変位 AX , AY を算出する。他方、角度 演算器 1 6 A 及び 1 6 B ではそれぞれ図形 A 及 び B の重心位置 A×・y 及び B×・y を原点として、 順次送られてくる特徴点記憶装置 1 0 A 及び JOBからの特徴点位置 ax·y 及び bx·y の角度 を計算する。図形A及びBにおける各特徴点の 角度 L Aa 及びL Bb は角度差演算器 1 7 に送られ、 特徴点対間の角度差が計算される。求められた 角度差は平均角度演算器18亿送出され、対応 する特徴点の回転角の平均値のを算出する。と の回転角の平均値のを求める場合、角度は法 2 # のモジュロ数であるため、そのまま平均値 を算出しただけでは正しい平均値が得られない 塩合がある。例えば、 5°と 3 5 5°の平均値は 180°と算出されるが、正しい平均値は 0°であ る。そとで、との実施例においては角度差演算

特照 問52-85841(3)

を備え、且つ、ファイル図形 B の特徴点の配位 及び特徴点間関係を保持した特徴点配協装置 1 0 B 及び関係配憶装置 1 1 B を有している。

両関係配憶装置 1 1 A 及び 1 1 B はそれぞれ 制御回路12から連続的にアクセスされ、特徴 点間関係 Ra 及び Rb が読出される。これら特徴 点間関係 Ra 及び Rb は関係一致検出回路 13 に 供給され、一致した特徴点対、例えば aw と bm、 av と bn 、 ak と bi 、 ab と bj が制御回路 1 2 に伝達される。制御回路12では関係一致検出 回路13において発見された対をなす特徴点の アドレスをそれぞれ特徴点記憶装置 10 A 及び 10 B に指示する。特象点記憶装置 10 A 及び 1 0 B の指定された特徴点位置 *× , *^y 及び b× , by が読出され、まず、重心演算器 J 4 A 及び14Bに供給される。重心演算器14A及 び14Bではそれぞれ順次送られてくる特徴点 位置から図形A及びBの重心位置 Axiy 及び B×,y を算出する。 各重心演算器 1 4 A 及び 1 4 Bで算出された重心位置 A^{X · Y} 及び B^{X · Y} は

器 1 7 からの角度差を補正する補正回路 1 9 を設け、との補正角 レジスタ 1 9 において最初の角度差演算器 1 7 の出力 α_0 をそのまま保持し、以後の出力 α_1 は $\beta_1=\alpha_1-\alpha_0$ (mod. 2π) で計算され、平均角 θ は次式で求めることができる。

$$\theta = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n} \theta_{i} + \alpha_{o} = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n} \alpha_{i} \cdots \cdots \cdots \cdots (3)$$

このことは、角度演算器 1 6 A 及び 1 6 B で 算出された値が互いに近傍にあることを利用し たものであり、これによつて、法 2 m による影響を回避することができる。

以上述べた通り、本発明では特徴点間関係を用いて対応でする特徴点を複数個選出し、各図形に対応を特徴点の角度を比較すると共に、両図形の対応する特徴点間の角度差の平均値を表して、内では、ないので、では、大がつい、では、ないに行なりととができる。

4.図面の簡単な説明

第1図(A)及び(B)は本発明の原理を説明するための図、第2図は本発明の一実施例を示すプロック図である。

記号の説明

10A,10B:特徴点記憶装置、11A,11B:関係記憶装置、12:制御回路、13: 関係一教検出回路、14A,14B: 重心演算器、15X,15Y: 減算器、16A,16B: 角度演算器、17:角度差演算器、18:平均角度演算器、19:補正角レジスタ。

(7127) 弁理士 後 藤 洋 介

